

Intermittent Operating Life Test System

RT-IOL 240A

Always as best partner,
We will do our best to grow up and develop with you.



INTERMITTENT OPERATING LIFE TEST SYSTEM

RT-IOL 240A는 전력반도체의 간헐적 동작 수명 시험을 위한 반도체 신뢰성 테스트 장비입니다.

TO, SMT Type의 전력반도체를 AEC-Q101과 MIL-STD-750 method 1037의 시험조건에 맞춘 테스트가 가능합니다.

RT-IOL 240A 모델의 장점은 높은 정확성과 유연성에 있습니다.

개별 DUT별로 다양한 측정 요소를 실시간으로 모니터링이 가능하고, 향상된 측정 기술의 적용을 통해 최상의 시험 결과를 제공합니다.

또한 정밀한 측정 데이터를 바탕으로, 개별 DUT별 정확한 불량 판정 결과를 제공합니다.

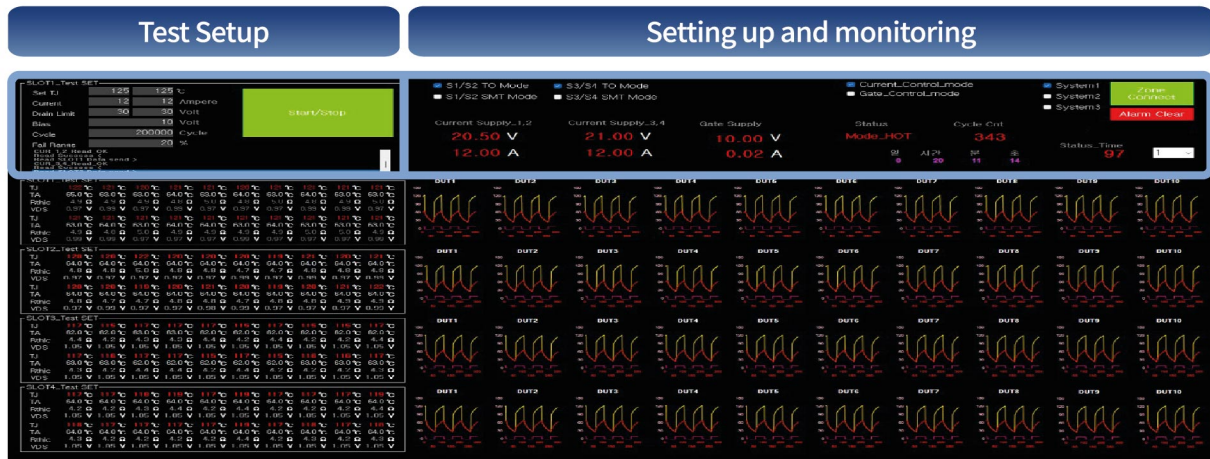
고객 요구 및 편의성에 따라, 시스템의 구성 및 GUI 변경이 가능하여 고객의 눈높이에 맞춘 다양한 구성의 장비 제공이 가능합니다.

SOFTWARE

RT-IOL 240A는 사용자 친화적, 직관적인 GUI 인터페이스를 제공합니다.

GUI를 통해 테스트 시험 조건의 설정과 수치 및 그래프를 통한 개별 DUT의 다양한 측정요소를 한 눈에 실시간으로 모니터링이 가능합니다.

GUI



Real-time monitoring

GUI FUNCTION

- Setting Tj, Current, Bias, Cycle, Fail Range
- Select Between Ccurrent_control_mode / Gate_control_mode
- Select Either System 1, System 2, System 3, Then Connect The Port
- Start / Stop Test
- Function Selection Mode When Performing Manual Testing
- Gate Power Manual On/off
- Slot Fan Manual On/off
- Monitoring Current Supply Values of Slot 1, 2, 3, 4
- Monitoring Gate Supply Values for All Slots
- Display Test Status
- Display Number Of Cycles Performed
- Display Test Time
- Display Current Time
- Beep Off
- Display Elapsed Time For Mode_hot, Mode_cool, Rthjc_test
- Select Dut To Monitor
- Display The Changes In Each Variable Graphically

SPECIFICATIONS

OVERVIEW	Model	RT-IOL-240A
	Test Condition	AEC-Q101 AND MIL-STD-750 Method 1037
	Test Mode	Current Control + Gate Bias Control
	Power Supply	• Gate – 30v / 20a • Voltage – 100v / 150a
	Cooling Mode	Air + Sink Cooling Unit
	Temperature Range	25°C ~ 200°C
	Temperature Accuracy	± 3°C
	Falling / Rising Time	60sec / 60sec *Junction Temp
	Thermocouple	K Type
	Device Contact	Device To Test Socket Set-up
	Main Board Contact	Slide Edge Type
CAPACITY	Density	240 Test Density Per 3 Test System
	Test Zone	6 Test Zone Per 3 Test System
	Test Slot	• 2 Test Slot Per 1 Test Zone • 20 Test Density Per 1 Test Slot
SUPPORT PRODUCTS	Power Device – TO	To-3p / To-247 / To-263 / To-220
	Power Device – SMT	Sot-series , Dpak , D2pak , Toll
MONITORING PARAMETER	TC/I-Load/U-Load/Ureverse/Rthjc / Tj	Individual Monitoring (100% / Dut)
	VDS (RDS(on))	Individual Monitoring (100% / Dut) • Accuracy: 0.01v • Accuracy Of Defective Judgment: 99.9%
	Current / Temperature	Individual Monitoring (100% / Dut)
	Gate Bias	Individual Monitoring (100% / Dut) 0~14v
DIMENSIONS	External Size	W-2,500 X D-1,000 X H-2340 (Mm)
	Weight	1,800kg





불 량 분 석

Delayer, FIB, EMMI, SEM, Image, SAT, X-Ray, Cross Section, Ceramic package

신뢰성 시험

하이스피드 신뢰성, 수명 시험, ESD 시험, 환경 시험, 특수 시험, 진동 시험, 실장 시험, IOL 시험

리버스엔지니어링

Semiconductor R/E, Sensor R/E, PCB R/E, Image Service

연구 개발

프로그램 개발, 하드웨어 개발, 모바일 응용 개발, 시스템 개발, 이미지 처리 개발, 분석/시험 솔루션 개발, 국가연구과제, Firmware 개발, FPGA, ARM, MCU 개발, PCB Artwork

보 드 / 장 비

Semi Test Board, Semi Test Socket, Semi Test System, PCB (FPCB, Rigid), SMT / Manual Ass'y, Real System Tester

CONNECT

www.raonsolution.com

대표전화 | 1533-2132 대표팩스 | 070-4275-5372 대표메일 | raon@raonsolution.com

본 사 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길10 청주미래누리터 303호

성 남 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545(상대원동, 한라시그마벨리), 606호

구 미 경상북도 구미시 산호대로 142-33 (공단동 295-5)